Высокочастотная перестраиваемая ЭПР-спектроскопия некрамерсовых ионов в кристаллах $AgGaSe_2$: Cr, $AgGaS_2$: Cr и CdGa₂S₄: Cr

© Г.С. Шакуров, А.Г. Аванесов*, С.А. Аванесов*

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Российской академии наук, Казань, Россия * Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия E-mail: shakurov@kfti.knc.ru

(Поступила в Редакцию 15 января 2009 г.)

Методом высокочастотного широкополосного ЭПР в диапазоне 65–530 GHz при T = 4.2 К исследованы кристаллы семейства халькопирита: AgGaSe₂, AgGaS₂ и CdGa₂S₄, допированные ионами хрома. Обнаружено, что в кристаллах AgGaSe₂ и AgGaS₂ ион Cr²⁺ находится в позициях ромбической и тетрагональной симметрии, тогда как в ранее исследованном CdGaS₄ имеются только тетрагональные центры. Для описания наблюдаемых спектров использован формализм спинового гамильтониана. Наряду с центрами двухвалентного хрома во всех исследуемых кристаллах в диапазоне частот 300–450 GHz обнаружены линии ЭПР, принадлежащие некрамерсовым ионам. Обсуждается природа этих линий.

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (проект РНП 2.1.1.7348) и грантом ВНШ.-6213.2006.2.

PACS: 71.70.Ej, 75.10.Dg, 76.30.Fc

1. Введение

Кристаллы тройных полупроводников AgGaSe2 и AgGaS₂ привлекают к себе внимание в связи с широким применением в нелинейной оптике. Их используют для удвоения частоты и трехчастотного смешивания. Параметрические генераторы на основе этих кристаллов могут обеспечивать непрерывно перестраиваемое излучение в спектральном диапазоне 1.0-10 µm с соответствующим лазером накачки. При этом наличие в чистых образцах неконтролируемых примесей и собственных дефектов, создающих глубокие уровни в запрещенной зоне, может коренным образом ограничить практическое применение этих кристаллов. Поэтому вопросом спектроскопии примесей посвящено большое количество работ. Методом ЭПР изучался кристалл AgGaS₂ с примесями Fe³⁺, Ni⁺, Ni³⁺, Co²⁺ и Cr⁺ [1–4] и AgGaSe₂:Ni⁺ [5].

После обнаружения лазерной генерации на ионе Cr^{2+} в соединениях $A^{II}B^{VI}$ были предприняты попытки найти новые лазерные матрицы с тетраэдрически координированными ионами двухвалентного хрома. Соединения с решеткой халькопирита представлялись одним из вариантов решения этой проблемы. Однако оказалось, что характерная для соединений $A^{II}B^{VI}$ люминесценция Cr^{2+} в ближнем ИК-диапазоне в этих кристаллах отсутствовала, что вообще ставило под сомнение вхождение ионов Cr^{2+} в решетку. При этом ЭПР-спектроскопия X- и Q-диапазонов, традиционно применяемая для идентификации парамагнитных примесей, в данном случае оказалось неэффективной, поскольку энергетические интервалы между спиновыми подуровнями иона Cr^{2+} превышали кванты ЭПР-спектрометров и получаемые спектры не позволяли уверенно идентифицировать двухвалентный хром. Надежным инструментом для изучения спектроскопических свойств ионов двухвалентного хрома является высокочастотная перестраиваемая ЭПР-спектроскопия, успешно зарекомендовавшая себя при исследовании ряда кристаллов [6–10]. В одной из выполненных работ изучено родственное соединение — CdGa₂S₄: Сг. Было установлено, что центры Cr²⁺ имеют тетрагональную симметрию. В рамках теории спингамильтониана определен набор спектральных параметров, позволивших получить хорошее согласие между расчетными и экспериментальными результатами [10].

В настоящей работе методом высокочастотного перестраиваемого ЭПР исследованы ионы двухвалентного хрома в кристаллах AgGaSe2: Cr и AgGaS2: Cr. В обоих кристаллах обнаружены центры ромбической и тетрагональной симметрии. Предложены модели центров и определен набор спектральных параметров. Получено хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных. При этом отсутствие люминесценции в ИК-диапазоне пока не нашло объяснения, хотя возможные причины этого можно обозначить уже сейчас. Дело в том, что в кристаллах AgGaSe2: Cr и AgGaS2: Cr, а также в кристалле CdGa₂S₂: Cr нами обнаружены линии поглощения в диапазоне частот 300-450 GHz. В то же время в соединениях $A^{II}B^{VI}$, в частности в ZnSe:Cr²⁺, подобные линии не регистрируются [11]. Анализ различий высокочастотных спектров ЭПР может позволить понять причину неудачи лазерного применения кристаллов с ячейкой халькопирита, активированных ионами Cr²⁺. Поэтому мы приводим здесь также результаты экспериментального исследования кристаллов $AgGaSe_2:Cr$, $AgGaS_2:Cr$ и $CdGa_2S_4:Cr$ в диапазоне частот 300-450 GHz и обсуждаем природу обнаруженных центров.

Кристаллы AgGaSe₂ и AgGaS₂ тетрагональной симметрии имеют структуру халькопирита, в которой катионы находятся в тетраэдрическом окружении. Пространственная группа — $I\bar{4}2d$, постоянные решетки составляют a = 5.991 Å, c = 10.885 Å для AgGaSe₂ и a = 5.757 Å, c = 10.304 Å для AgGaS₂ [5,12].

2. Эксперимент

Кристаллы AgGaS₂ и AgGaSe₂ выращивались методом Бриджмена-Стокбаргера из бинарных компонентов стехиометрического состава. Кристаллы, активированные ионами хрома, были получены из расплавов составов Ag_{1.0399}Ga_{0.9599}Cr_{0.01}S(Se)_{1.9698} в вакуумированных кварцевых ампулах диаметром 20 mm и длиной 120 mm. Масса шихты в ампуле составляла 100-150 g. Ампулу с шихтой устанавливали в печь для выращивания в зону разогрева. Температуру шихты доводили до плавления, и выдерживали ампулу при этой температуре в течение 3 h, после чего ампулу опускали в зону кристаллизации. Оптимальные параметры ростового процесса следующие: скорость прохода зоны кристаллизации $6 \pm 2 \text{ mm/day}$, температурный градиент в зоне кристаллизации $10 \pm 2^{\circ}$ С/ст. Характерная длительность ростового процесса составляла 20 суток.

Для исследований были выбраны образцы в форме прямоугольных параллелепипедов. Кристалл AgGaSe₂:Cr имел размер $10 \times 14 \times 15$ mm, а AgGaS₂:Cr — $10 \times 15 \times 15$ mm. Описание образцов CdGa₂S₄:Cr сделано ранее [10]. Измерения проводились



Рис. 1. Спектр ЭПР кристалла AgGaSe₂: Сг. *а* — ромбический центр, переход $|+1\rangle \leftrightarrow |+2\rangle$; *b* — тетрагональный центр, переход $|-1\rangle \leftrightarrow |-2\rangle$; *c* — ромбический центр, переход $|-1\rangle \leftrightarrow |-2\rangle$; *d* — сателлитные линии. Частота 193 GHz. Ось с отклонена от магнитного поля на 35°.



Рис. 2. Зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля для кристалла AgGaSe₂: Сг. В || с. *а* — ромбический центр, *b* — тетрагональный центр. Точки — эксперимент, линии — расчет.

на широкополосном (65–530 GHz) квазиоптическом ЭПР-спектрометре, использующем в качестве генераторов излучения лампы обратной волны при температуре жидкого гелия в магнитных полях до 0.9 Т [13].

Если условно обозначить спиновые состояния иона Cr^{2+} в порядке возрастания энергии как $|0\rangle$, $|-1\rangle$, $|+1\rangle$, $|-2\rangle$ и $|+2\rangle$, то в ромбическом кристаллическом поле имеется пять синглетных уровней. В кристалле AgGaSe2: Cr были зарегистрированы резонансные переходы $|0\rangle \leftrightarrow |+1\rangle$, $|\pm 1\rangle \leftrightarrow |\pm 2\rangle$ и $|0\rangle \leftrightarrow |\pm 2\rangle$. На рис. 1 представлен вид спектра ЭПР, а на рис. 2, а показаны зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля для ромбического центра в ориентации кристалла **В** || **с**. Расщепления в нулевом поле (Zero-Field-Splitting — ZFS) были измерены прямым методом и имели следующие величины: 185, 186.5, 210.1, 211.6, 263.8 и 265.3 GHz (±0.5 GHz). Угловые зависимости спектров ЭПР одного из переходов измерены на двух разных частотах (рис. 3). Характер угловых зависимостей свидетельствует о наличии магнитно-неэквивалентных центров. В плоскости (110) наблюдалось четыре магнитно-



Рис. 3. Угловые зависимости спектров ЭПР при вращении кристалла вокруг оси [110]. $\varphi = 180^{\circ}$ соответствует **B** || **c**. *a* — ромбический центр, частота 186 GHz; *b* — ромбический центр, частота 193 GHz; *c* — тетрагональный центр, частота 193 GHz. Точки — эксперимент, линии — расчет.

неэквивалентных центра. В произвольной ориентрации кристалла магнитная кратность K^M_{α} равнялась восьми.

Для центров тетрагональной симметрии спиновые состояния Cr^{2+} образуют синглет $|0\rangle$, дублет $|\pm 1\rangle$ и дублет $|\pm 2\rangle$. Регистрировались резонансные переходы типа $|0\rangle \leftrightarrow |+1\rangle, |\pm 1\rangle \leftrightarrow |\pm 2\rangle$ и $|0\rangle \leftrightarrow |\pm 2\rangle$. Измеренные расщепления в нулевом поле (ZFS) имели следующие величины: 199.3, 200, 265.3 и 266 GHz (±0.5 GHz). На рис. 2, b представлены зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля для тетрагонального центра в ориентации кристалла В || с. Исследование угловых зависимостей спектров ЭПР при вращении в плоскости (110) не выявило магнитно-неэквивалентных центров, а сама зависимость имела типичный для некрамерсовых ионов вид $\sim 1/\cos \alpha$ (рис. 3). В данном случае магнитная ось z комплекса совпадала с кристаллографической осью с кристалла. Это дало возможность измерить параллельный *g*-фактор ($g_{\parallel} = 1.92 \pm 0.02$).

Ширины линий ЭПР в ориентации **B** || **c** составляли ~ 60 и ~ 65 G для тетрагонального и ромбического центров соответственно. В спектрах ЭПР присутствовали также многочисленные слабые сателлитные линии, подробное исследование которых не представлялось возможным из-за малой величины отношения сигнал/шум. Однако зависимость частот резонансных переходов от магнитного поля для ориентации **B** || **c** позволяет сделать вывод, что природа этих линий также связана с двухвалентным хромом.

В кристалле AgGaS₂:Сг для ромбического центра удалось зарегистрировать резонансные переходы между состояниями $|\pm 1\rangle \leftrightarrow |\pm 2\rangle$ (166–249 GHz) и состояниями $|0\rangle \leftrightarrow |\pm 2\rangle$ (273–282 GHz). Переходы $|0\rangle \leftrightarrow |\pm 1\rangle$ обнаружить не удалось. Причину этого мы связываем

с сильной ромбической составляющей. (Расщепление между состояниями $|\pm1\rangle$ составляет 49 GHz.) Электронные уровни в слабых магнитных полях идут практрически параллельно друг другу, и метод регистрации на частоте магнитной модуляции не позволяет зарегистрировать сигнал ЭПР. На рис. 4 представлены зависимости всех наблюдаемых частот резонансных переходов от величины магнитного поля. Измеренные величины ZFS составили 180, 184, 229, 233, 275.5 и 279.5 GHz (±0.5 GHz). Ширины линий ЭПР в ориентации **В** || с были около 40 G. Вид спектров ЭПР одного из резонансных переходов при изменении **В** в плоскости (110) представлен на рис. 5. Из рисунка видно, что в кристалле



Рис. 4. Зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля для кристалла AgGaS₂:Cr. **B** || **c**. Треугольники — ромбический центр, кружки — тетрагональный центр, линии — расчет.



Рис. 5. Вид спектров ЭПР при вращении кристалла $AgGaS_2$: Сг вокруг оси [110]. Частота 192 GHz. Угол 0° соответствует **В** || **с**.

имеются магнитно-неэквивалентные центры, оси z которых развернуты на небольшие углы друг относительно друга. При отклонении оси c от направления магнитного поля линии ЭПР быстро уширялись, и отношение сигнал/шум становилось слишком малым. Это ограничило диапазон углов, при котором наблюдались спектры ЭПР, а также не позволило экспериментально определить общее количество магнитно-неэквивалентных центров. Зарегистрированы по крайней мере три линии разной интенсивности, что свидетельствует о неполном разрешении спектра ЭПР.

Интенсивность сигналов ЭПР для тетрагонального центра была существенно меньше, чем для ромбического, причем линии ЭПР наблюдались только в слабых магнитных полях в ориентации **B** || с. Величины ZFS составили 206.8 и 207.6 GHz (±0.5 GHz). График зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля для тетрагонального центра располагается симметрично посредине между соответствующими зависимостями для переходов $|\pm 1\rangle \leftrightarrow |\pm 2\rangle$ ромбического центра (рис. 4). Необходимо отметить, что, хотя в основном удалось зарегистрировать только два типа резонансных переходов $|+1\rangle \leftrightarrow |+2\rangle$ и $|-1\rangle \leftrightarrow |-2\rangle$, мы с большой уверенностью приписываем эти линии ЭПР тетрагональному центру двухвалентного хрома. Основным доводом в пользу этого служит наличие сходной симметричной картины ZFS в кристалле AgGaSe2: Cr. Кроме того, при измерении величины ZFS в очень слабых полях в кристалле AgGaS₂:Сг был зарегистрирован спектр ЭПР, обязанный запрещенному резонансному переходу с $\Delta m_s = 3$, что указывает на то, что переходы происходят между состояниями $|\pm 1\rangle$ и $|\pm 2\rangle$ (рис. 6). Аналогичные переходы наблюдались и в AgGaSe₂: Cr. Величина g-фактора оказалась равной $g_{\parallel} = 1.96 \ (\pm 0.02).$



Рис. 6. Вид спектров ЭПР кристалла $AgGaS_2$: Сг в слабых магнитных полях. **В** || **с**. *a* — 207.75 GHz, *b* — 207.7 GHz, *c* — 207.65 GHz. Стрелками показаны запрещенные резонансные переходы.



Рис. 7. Зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля. **В** || **с**. *a* — тетрагональный центр в AgGaSe₂:Cr; *b* — тетрагональный (ZFS = 349.7 GHz) и низкосимметричный (ZFS = 270 и 435 GHz) центры в кристалле AgGaS₂:Cr, *c* — тетрагональный центр в кристалле CdGa₂S₄:Cr.

Кроме центров двухвалентного хрома в кристаллах AgGaS₂: Cr, AgGaSe₂: Cr, a также в исследованном ранее CdGa₂S₄: Cr обнаружены линии ЭПР с ZFS более 300 GHz. На рис. 7, *a*-*c* представлены зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля для этих систем. В кристалле AgGaSe₂: Cr линии ЭПР, имеющие ZFS = 343.5 (±0.5) GHz, принадлежат предположительно тетрагональному центру (рис. 7, *a*). Об этом свидетельствует линейный характер зависимости от магнитного поля. Угловая зависимость линий

Парамагнитный центр	$ B_{2}^{0} $	B_{2}^{2}	B_{4}^{0}	B_{4}^{2}	B_4^4	Углы Эйлера	Компоненты g-тензора
AgGaSe ₂ , ромбический центр	21.87	4.77	0.0025	0.0789	0.0226	$lpha = 298.8 \ eta = 2.6 \ \gamma = 211.7$	$g_{xx} = 1.91$ $g_{yy} = 1.98$ $g_{zz} = 1.98$
AgGaSe2, тетрагональный центр	22.16		0.0039		0.292		$egin{array}{ll} g_{\parallel} = 1.92 \ g_{\perp} = 1.98 \end{array}$
AgGaS ₂ , ромбический центр	23.05	3.24	-0.0167	1.2248	0.1719		$g_{zz} = 1.90$
AgGaS ₂ , тетрагональный центр					0.0333		$g_{\parallel} = 1.96$

Константы спинового гамильтониана иона Cr^{2+} (величины B_n^m приведены в GHz)

ЭПР от магнитного поля, имеющая вид пропорциональный функции $1/\cos \alpha$, не выявила магнитно-неэквивалентных центров. По линейной зависимости энергии резонансных переходов от магнитного поля был определен *g*-фактор: $g_{\parallel} = 1.94 ~(\pm 0.02)$. Сходные результаты получены для кристалла CdGa₂S₄: Cr (рис. 7, *c*). Результаты измерений дали следующие величины: ZFS = 308.5 GHz, $g_{\parallel} = 1.95 ~(\pm 0.02)$.

В кристалле AgGaS₂: Сг (рис. 7, *b*) наряду с тетрагональным (ZFS = 349.7 GHz, $g_{\parallel} = 1.97 \pm 0.02$) обнаружен также и низкосимметричный центр. Две ветви графика с ZFS, равными 270 и 435 GHz, располагаются симметрично относительно соответствующих зависимостей, полученных для тетрагонального центра. Измерение угловой зависимости низкосимметричного центра не выявило магнитно-неэквивалентных спектров ЭПР. Мы полагаем, что в данном случае они не разрешаются и находятся в пределах ширин линий.

Ширины линий тетрагональных центров оказались существенно различными для разных кристаллов. Для ориентации **B** || **c** были получены значения 25, 120 и 200 G для кристаллов AgGaS₂:Cr, AgGaSe₂:Cr и CdGa₂S₄:Cr соответственно.

3. Теория и обсуждение

Для теоретического описания наблюдаемых спектров ромбической симметрии мы использовали спиновый гамильтониан вида

$$H = \beta \mathbf{B}_{g} \mathbf{S} + B_{2}^{0} O_{2}^{0} + B_{4}^{0} O_{4}^{0} + B_{4}^{4} O_{4}^{4} + B_{2}^{2} O_{2}^{2} + B_{4}^{2} O_{4}^{2},$$

для представления которого применялись волновые функции

$$(|+1\rangle + |-1\rangle)/\sqrt{2}, \quad (|+1\rangle - |-1\rangle)/\sqrt{2},$$

 $(|+2\rangle + |-2\rangle)/\sqrt{2}, \quad (|+2\rangle - |-2\rangle)/\sqrt{2}$ и $|0\rangle.$

где за ось z выбрано направление [001] кристалла.

В кристалле AgGaSe₂ при определении величин B_n^m в первом приближении учитывались только диагональные матричные элементы (при **B** = 0) и измеренные величины ZFS. Для дальнейшей оптимизации расчетных данных

использовался численный метод нахождения собственных значений гамильтониана и набор экспериментальных зависимостей частот резонансных переходов от магнитного поля (точки на рис. 2). При этом в гамильтониане учитывалась только *z*-компонента зеемановской энергии, поскольку углы отклонения магнитных z-осей от оси **с** кристалла невелики (менее 3°), и такое приближение вполне оправдано. Окончательная подгонка параметров осуществлялась численным методом с использованием угловых зависимостей спектра ЭПР. При этом варьировались только значения и направляющие косинусы компонент тензора второго ранга. Значения компонент тензора четвертого ранга, определенные на втором этапе, фиксировались, а компоненты g_x и g_y полагались равными $g_x = g_y = 1.98$. Расчетные зависимости, построенные на основе полученных значений, представлены на рис. 2 и 3 сплошными линиями. Для ромбического центра Cr²⁺ в кристалле AgGaS₂ мы вынуждены были ограничиться подгонкой зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля, поскольку угловая зависимость спектров ЭПР была измерена в слишком малом диапазоне углов.

Тетрагональный центр в кристалле AgGaSe₂ рассчитывался с использованием спин-гамильтониана вида

$$H = \beta \mathbf{B}g_{\parallel} \mathbf{S} + \beta \mathbf{B}g_{\perp} \mathbf{S} + B_2^0 O_2^0 + B_4^0 O_4^0 + B_4^4 O_4^4.$$

Спектральные параметры также определялись в несколько этапов с помощью измеренных величин ZFS, полевых и угловых зависимостей спектров ЭПР. На рис. 2, *b* и 3, *c* расчет представлен сплошной линией. Константы спин-гамильтониана тетрагонального центра в AgGaS₂ были определены частично из-за недостатка экспериментальных значений. Все полученные параметры сведены в таблицу.

Анализируя полученные величины, можно сделать следующие замечания. Наши попытки использовать угловые зависимости спектров ЭПР для оптимизации значений *g*-тензора и тензоров четвертого ранга не приводили к лучшему согласию с экспериментом, но часто давали величины, лишенные физического смысла. Поэтому при окончательной подгонке параметров тензоры четвертого ранга не варьировались, а значения *g*-фактора устанавливались в соответствии с известными

2165

из литературы данными. Это связано с тем, что в нашем случае тензоры второго ранга существенно превосходят по величине зеемановскую энергию и вклад тензоров четвертого ранга. Именно они определяют расчетные угловые и полевые зависимости. Кроме того, при учете небольших поправок, вызванных анизотропией *g*-фактора, необходимо принять во внимание, что частота определялась с точностью ± 0.5 GHz. Зеемановская энергия в угловых зависимостях не превышала 15 GHz. Таким образом, абсолютная ошибка в определении *g*-фактора из угловых зависимостей составляла 3%. При наличии линейной зависимости частот резонансных переходов от магнитного поля, когда параллельный *g*-фактор определялся по относительным изменениям частоты и поля, погрешность составляла 1%.

В целом получено хорошее согласие экспериментальных и расчетых зависимостей, которое является подтверждением того, что наблюдаемые спектры ЭПР принадлежат двухвалентному хрому. Замечательной особенностью полученных результатов является их взаимосвязанность. Симметричное расположение ветвей переходов $|\pm1\rangle \leftrightarrow |\pm2\rangle$ тетрагонального центра относительно ромбического (рис. 2) в AgGaSe₂: Сг позволило осуществить целенаправленный поиск линий ЭПР в нужном интервале 300–450 GHz в кристалле AgGaSe₂: Сг, обнаруживший слабые линии некрамерсового тетрагонального центра, был вызван наличием интенсивных линий в этом частотном диапазоне в кристаллах CdGa₂S₄: Сг и AgGaS₂: Сг.

При рассмотрении вопроса о типе замещения ионов Cr²⁺ в первую очередь учитываем наличие центров тетрагональной симметрии. Для кристаллов AgGaSe2: Cr и AgGaS₂:Cr это означает, что двухвалентный хром занимает одну из катионных позиций, локальная симметрия которых S₄. Каждая из катионных позиций имеет кратность, равную двум, но в случае тетрагональной симметрии спектры ЭПР неразличимы. Из симметричного расположения ветвей ромбических центров относительно тетрагональных (рис. 2, 4) следует, что центры хрома ромбической симметрии находятся в том же кристаллическом окружении, подвергаясь при этом дополнительному ромбическому искажению. Искажение может вызываться наличием компенсатора заряда, поскольку замещение Ag⁺ или Ga³⁺ на Cr²⁺ неизовалентно. Магнитная кратность ромбического спектра в AgGaSe₂: Cr $(K^M_{\alpha} = 8)$ может быть объяснена существованием центров Cr²⁺ с четырьмя равноудаленными компенсаторами в двух неэквивалентных позициях. Таким центром может быть хром в позиции Ag+, где компенсаторами являются ближайшие вакансии серебра. Косвенным подтверждением такой модели являются данные работы по ЭПР-спектроскопии Cr^+ в AgGaS₂ [4]. В ней авторы пришли к выводу, что Cr⁺ локализован в позиции Ag⁺. Таким образом, мы полагаем, что тетрагональные и ромбические центры двухвалентного хрома в кристаллах AgGaS2 и AgGaSe2 связаны с замещением позиции серебра, причем в случае тетрагональной сим-

Природа центров, обнаруженных в частотном интервале 300-450 GHz (10-15 cm⁻¹), связана с некрамерсовыми ионами. На это указывают как характерные угловые зависимости, так и наличие синглет-синглетных переходов в низкосимметричном центре в кристалле AgGaSe2: Cr. Хотя на таких высоких частотах нулевые расщепления имеют ионы двухвалентного железа, *g*-факторы для тетрагональных центров в кристаллах AgGaS₂:Cr, AgGaSe₂:Cr и CdGa₂S₄:Cr оказались меньше 2, что не согласуется с величинами, характерными для Fe²⁺. По этой же причине необходимо исключить из рассмотрения ионы двухвалентного никеля. Присутствие в кристалле Cr⁴⁺ маловероятно. Во-первых, такое валентное состояние реализуется обычно при изовалентном замещении; во-вторых, попытка описать угловые зависимости спином S = 1 выявила грубые расхождения расчета и эксперимента. Кроме того, в литературе не встречаются сведения о таких больших нулевых расщепления для иона Cr^{4+} . Ион Fe^{4+} (S=2) может иметь большие расщепления и g < 2, но он образуется, как правило, после облучения при условии, что в кристалле имеются ионы Fe³⁺. Поскольку в кристалле две катионные позиции, можно допустить, что центры с $ZFS \sim 300-450 \, GHz$ связаны с ионами двухвалентного хрома в позиции галлия. При этом наблюдаемые переходы могут быть идентифицированы только как переходы типа $|0\rangle \leftrightarrow |\pm 1\rangle$, так как никаких других резонансных переходов с меньшими частотами мы не обнаружили и, кроме того, вид полевой зависимости (рис. 7, b), где присутствуют тетрагональный и низкосимметричный центры, указывает на наличие только двух резонансных переходов. Используя те же рассуждения о симметричности расположения ветвей, что и в случае иона Cr^{2+} в AgGaS₂:Cr и AgGaSe₂:Cr, приходим к выводу, что парамагнитный центр локализован в тетраэдре. В литературе, посвященной ЭПР-спектроскопии Cr²⁺, обычно приводятся значения ZFS, соответствующие $D \sim 1.8 - 2.5 \, {\rm cm}^{-1}$. Однако это может быть связано с малой распространенностью высокочастотной техники ЭПР, необходимой для регистрации таких центров. Более существенным возражением могут служить выводы теоретической работы [14], посвященной проблемам локализации ионов Cr²⁺ в кристалле тиогаллата кадмия CdGa₂S₄: Cr. В ней авторы, используя полученные нами экспериментальные данные, сделали расчет для констант тонкой структуры в позициях кадмия и галлия. Согласно их вычислениям, двухвалентный хром замещает кадмий, тогда как в галлиевой позиции величина D для иона Cr²⁺ должна быть меньше. Таким образом, пока нет ясности с природой обнаруженных центров. Выяснение этого вопроса требует дальнейших исследований.

4. Заключение

В кристаллах AgGaS₂: Cr и AgGaSe₂: Cr идентифицированы центры Cr^{2+} тетрагональной и ромбической симметрии. Определен набор спектральных параметров, позволяющих получить хорошее согласие теории и эксперимента. Предложены модели центров, в которых ион Cr^{2+} занимает катионную позицию серебра, причем в случае тетрагональных центров компенсатор заряда удален от иона хрома, а в случае ромбической симметрии компенсатором заряда является ближайшая вакансия серебра. В крислалах AgGaS₂: Cr, AgGaSe₂: Cr и CdGa₂S₄: Cr обнаружены центры, принадлежащие некрамерсовым ионам, локализованным в катионных позициях. Измерены их ZFS и *g*-факторы.

В заключение авторы выражают глубокую благодарность В.А. Шустову за проведение рентгеноструктурного анализа, М.М. Зарипову и А.А. Галееву за полезные дискуссии и помощь при проведении расчетов.

Список литературы

- G. Brandt, A. Rauber, J. Schneider. Solid State Commun. 12, 481 (1973).
- [2] H.J. von Bardeleben, A. Goltzene, C. Schwab. Appl. Phys. Lett. 32, 741 (1978).
- [3] H.J. von Bardeleben, C. Schwab, R.S. Feigelson, R.K. Route. J. Phys. C 17, 4201 (1984).
- [4] H.J. von Bardeleben, C. Schwab, R.S. Feigelson. J. Phys. C 15, 5269 (1982).
- [5] K.T. Stevens, N.Y. Garces, Lihua Bai, N.C. Jiles, L.E. Haliburton, S.D. Setzler, P.G. Schunemann, R.K. Route, R.S. Feigelson. J. Phys.: Cond. Matter 16, 2593 (2004).
- [6] В.Ф. Тарасов, Г.С. Шакуров, А.Н. Гавриленко. ФТТ 37, 499 (1995).
- [7] М.М. Зарипов, В.Ф. Тарасов, В.А. Уланов, Г.С. Шакуров, М.Л. Попов. ФТТ 37, 806 (1995).
- [8] М.М. Зарипов, В.Ф. Тарасов, В.А. Уланов, Г.С. Шакуров. ФТТ 38, 452 (1996).
- [9] М.М. Зарипов, В.А. Уланов, В.Ф. Тарасов, Г.С. Шакуров. ФТТ 44, 1958 (2002).
- [10] А.Г. Аванесов, В.В. Бадиков, Г.С. Шакуров. ФТТ **45**, 1382 (2003).
- [11] А.Т. Лончаков, С.М. Подгорных, В.И. Соколов, Н.Б. Груздев, Г.С. Шакуров. ФТТ 48, 1610 (2006).
- [12] A.A. Lavrentyev, B.V. Gabrelian, V.A. Dubeiko, I.Ya. Nikiforov, J.J. Rehr. J. Phys. Chem. Solids 63, 227 (2002).
- [13] V.F. Tarasov, G.S. Shakurov. Appl. Magn. Res. 2, 571 (1991).
- [14] Kuang Xiao-Yu, Tan Xiao-Ming, Zhou Kang-Wei. Chem. Phys. Lett. 432, 218 (2006).